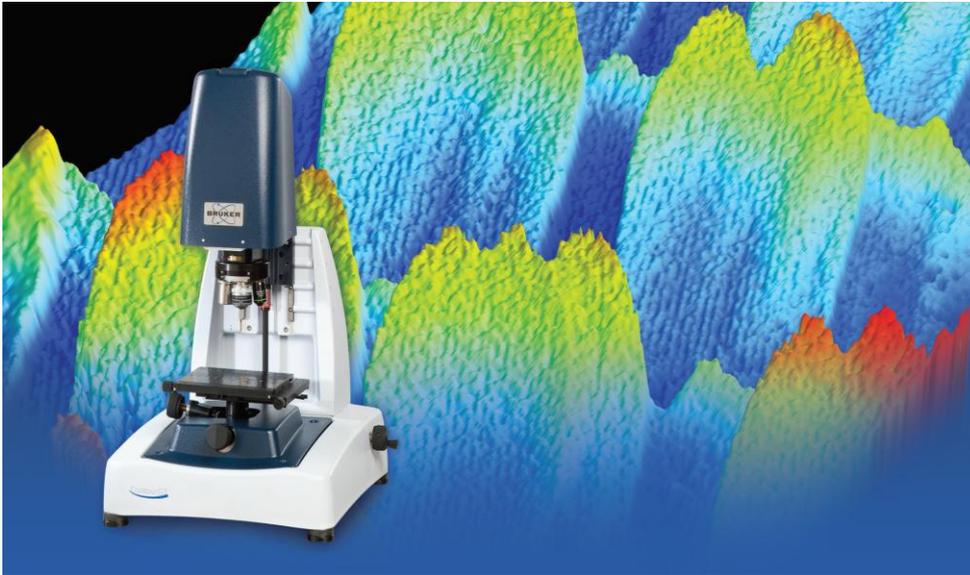


Bruker ContourGT-K 白光干涉仪

布鲁克 (Bruker) 是表面测量和检测技术的全球领导者，服务于科研和生产领域。新一代白光干涉仪 ContourGT 系列结合了先进的 64 位多核操作和分析处理软件，专利技术白光干涉仪 (WLI) 硬件和前所未有的操作简易性，是历年来最先进的 3D 光学表面轮廓仪系统。该系统拥有超大视野内亚埃级至毫米级的垂直计量范围，样品安装灵活，且具有业界最高的测量重复性。ContourGT 系列是当今生产研究和质量控制应用中，最广泛使用和最直观的 3D 表面计量平台。



应用：

对 LED 行业、太阳能行业、触摸屏行业、半导体行业以及数据存储行业等，提供全方位非接触式测量方案，样品从小至微米级别的微电子器件 (MEMS)，大到整个引擎部件，都可以获得表面形貌、粗糙度、三维轮廓等精准数据。

特征：

- ◆ **业界最高的垂直分辨率，最强大的测量性能：**
 - 0.5~200 倍的放大倍率；
 - 任何倍率下亚埃级至毫米级垂直测量量程；
 - 高分辨率摄像头；
- ◆ **测量硬件的独特设计，增强生产环境中的可靠性和重复性：**
 - 较高的震动的容忍度和 GR&R 测量的能力
 - 专利的自动校准能力；
- ◆ **多核处理器下运行的 Vision64™ 软件，大大提高三维表面测量和分析速度**
 - 数据处理速度提高几十倍；
 - 分析速度提高十倍；
 - 无以伦比的大量数据无缝拼接能力；
- ◆ **高度直观的用户界面，拥有业界最强的实用性，操作简便和分析功能强大**
 - 优化的用户界面大大简化测量和数据分析过程；
 - 独特的可视化操作工具；
 - 可自行设置数据输出的界面；

【主要参数】

垂直量程	0.1nm 至 10mm (闭环无拼接)
垂直分辨率	0.1nm
电动样品台移动范围	±150mm (XY 轴)/100mm(Z 轴),XYZ 三轴自动
横向取样间隔	0.1μm 至 13.2μm (由配备的 FOV 目镜和干涉物镜倍数决定)
光学横向分辨率	最高 350nm
台阶测试精度	0.75%
台阶重复性	<0.1% 1σ
倾斜调整	手动样品台调节 ± 6°
垂直扫描速度	最快 47um / 秒 , 用户可自行设定
转塔调节	手动自动可选
分析软件功能	可进行二维和三维分析, 多区域自动分析 (可对目标区域进行统计编号, 可自动分析目标区域内高度或深度分布情况), 可分析表面粗糙度, 可分析样品表面缺陷及台阶高度, 并可对多次测量数据进行统计, 得到详细的统计报告 (含平均值, 方差, 最小值, 最大值等)。可进行编程自动多点测量。可提供的数据包括高逼真度的三维图像, 二维剖面图, 以及大量完整的表面粗糙度参数。

冠乾科技 (上海) 有限公司

www.grantech.net.cn

地址 : 上海市浦东新区康桥工业区秀浦路 800 号 50 号楼 1502 室

电话 : 021-2096 2769 邮箱 : info@grantech.net.cn

